

电阻率测试，芯片耐压测试方法

产品名称	电阻率测试，芯片耐压测试方法
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

电阻率测试，芯片耐压测试方法

将黄铜环置于涂有隔离剂的金属板或玻璃板上。

1.2将预先脱水的试样加热熔化，不断搅拌,以防u止局部过热，加!热温度不得高于试样估计软化点100C，加热时间不超过30分钟。用筛过滤。将试样注人黄铜环内至略高出环面为止。若估计软化点在120C以上时，应将黄铜环与金属板预热至80~ 100C。”

1.3试样 在15 ~ 30亡的空气中冷却30分钟后，用热刀刮去高出环面的试样，使与环面齐平。

1.4估计 软化点不高于80C的试样，将盛有试样的黄铜环及板置于盛满水的保温槽内，水温保持在 5 ± 0.5 C，恒温15分钟。估计软化点高于80C的试样，将盛有试样的黄铜环及板置于盛满甘油的保温槽内，甘油温度保持在 32 ± 1 C,恒温15分钟,或将盛试样的环水平地安放在环架中承板的孔内，然后放在盛有水或甘油的烧杯中，恒温15分钟,温度要求同保温槽。